

△の数		訂正記事	担 当	検 図	年 月 日	△の数		訂正記事	担 当	検 図	年 月 日
△						△					
△						△					
適 用 規 格											
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃ (注1)				保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)				
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)				保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)				
	適合コネクタ	DF51K-*(D)S-2C(###)				電 圧	250V AC/DC				
	適合電線	AWG#30				電 流	AWG 30 : 0.5A				
	被覆外径	φ0.8 mm									
性 能											
項 目		試 験 方 法				規 格			QT	AT	
構造											
外観,構造,仕上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。			○	○	
表示		目視にて確認する。							○	○	
電氣的性能											
低電圧, 低電流下の接触抵抗		20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。				30 mΩ 以下			○	-	
機械的性能											
繰り返し動作 (Snメッキ)		30 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
繰り返し動作 (Auメッキ)		50 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
耐振性		周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
耐衝撃性		加速度 490 m/s2, 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。							○	-	
環境的性能											
定常状態の耐湿性		温度 +40 ± 2℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
温度サイクル		温度 -55 → 105℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。											
					製 図	担 当	検 図	承 認	リリース		
					KIM. Y. H	KIM. Y. H	LIM. S. M	LIM. S. M	ENG 20.02.13 DEPT		
					18.10.02	18.10.02	18.10.02	18.10.02			
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。いる。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HIROSE KOREA CO.,LTD.			製 品 規 格 表				製品名 DF51K-30SCA (800)				
コード NO.(OLD)		図番.		製品コード		1					
CL		JLC4-611517				CL 6652-0070-4-800					
						1					